颐光科技
OPTICS

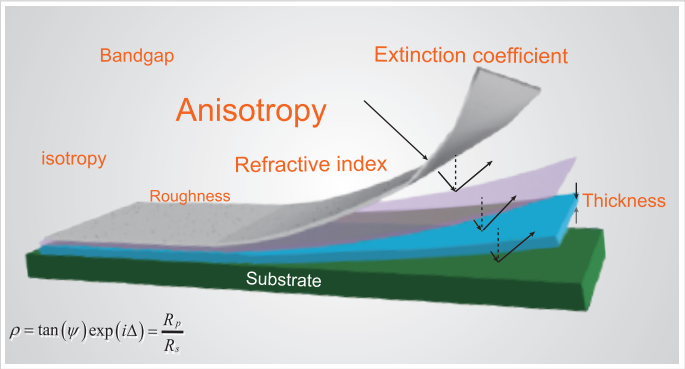
www.eoptics.com.cn

SE-VE 型光谱椭偏仪

SE-VE Spectroscopic Ellipsometer

- 超高性价比光学椭偏测量解决方案
- 紧凑集成化设计，极致用户操作体验
- 一键快速测量分析，人机交互设计，使用便捷
- 丰富的材料数据库和算法模型库，强大的数据分析能力

武汉颐光科技有限公司
WUHAN EOPTICS TECHNOLOGY CO., LTD.

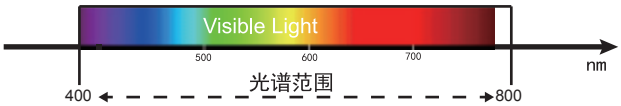


SE-VE 是一款超高性价比高精度快速测量光谱椭偏仪，可通过椭偏参数、透射/反射率等参数的测量，实现单层到多层薄膜膜厚、光学参数等快速表征分析， 适用于各种薄膜材料的快速测量分析。

产品特点

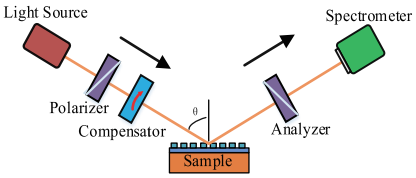
■ 光谱范围覆盖广

采用高性能卤素灯光源，光谱覆盖可见光范围到近红外区域；



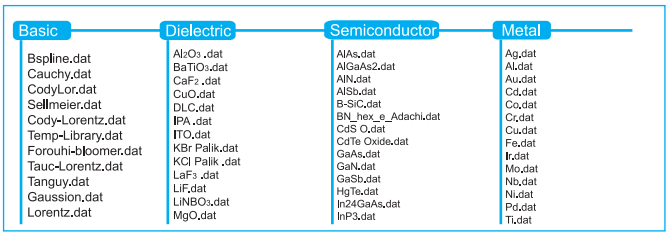
■ 单旋转补偿器调制技术

高精度旋转补偿器调制、PCRSA配置，实现Psi/Delta光谱数据高速采集；



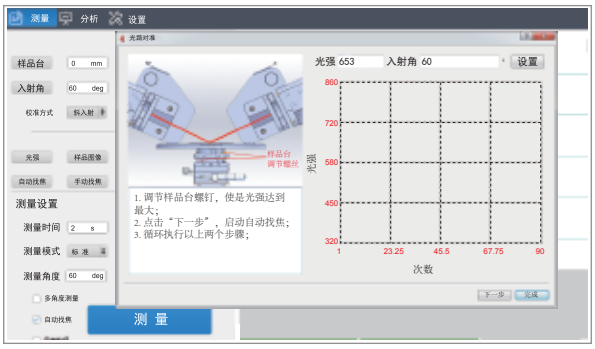
■ 丰富的材料数据库和算法模型

数百种材料数据库、多种算法模型库，涵盖了目前绝大部分的光电材料；



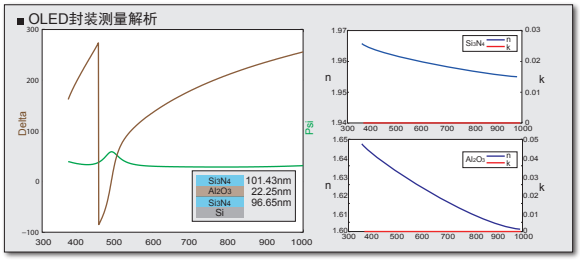
■ 向导式交互界面

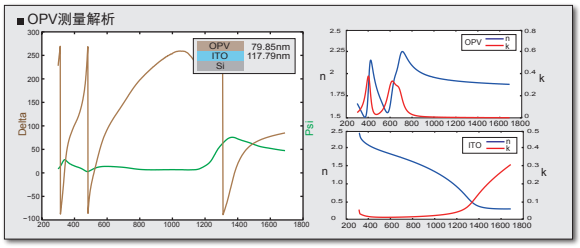
软件向导交互式人机界面操作，为用户提供优质操作体验；



■ 强大软件应用分析能力

针对半导体、集成电路、新型平板显示、薄膜光伏等领域中材料的厚度、光学常数、结构信息等数据通过建模拟合进行全面的快速分析；建立针对材料模型库、一键快捷调用；





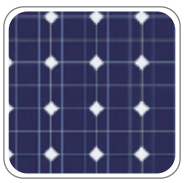
技术参数

基本功能	一次性获取Psi/Delta、R等光谱
光谱范围	400-800nm
测量时间	0.5-5s
入射角范围	65°
光斑尺寸	2-3mm
重复性精度	0.05nm（100nmSiO_2硅片）
支持样件尺寸	支持160mm样件
分析软件	多达数百种的光学材料数据库，支持用户自定义
	提供多层各向同性光学薄膜建模仿真与分析功能

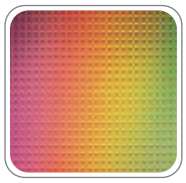
产品应用

SE-VE 型光谱椭偏仪广泛应用于科研/企业中各种单层到多层薄膜膜厚以及光学常数等快速表征分析：

OLED


光伏电池

LED


IC集成电路

科学研究

半导体

医药

光学

生物

Tel: 027-87001728
E-mail: info@eoptics.com.cn
硕光科技 EOPTICS